

## S31b Swift/BAT 硬 X 線サーベイによる南天 AGN 完全サンプルの可視追求観測

石野佑紀子、上田佳宏 (京都大)、橋本康弘 (南アフリカ天文台)

Swift 衛星の BAT 検出器によるサーベイは、14–195 keV という透過力の極めて強いエネルギーバンドにおいて過去の 10 倍の感度を実現した画期的なサーベイであり、近傍宇宙における最も無バイアスな AGN サンプルを提供している。サーベイ観測を生かすための決定的に重要な研究は、新しく発見された天体の多波長追求観測を行い、その性質を解明することである。特に、可視スペクトルの取得は、同定のために必要不可欠であり、AGN 構造の理解に鍵を握るものである。

これまで可視光では、狭輝線領域から放射される [O III] 輝線の強度を用いた AGN サーベイが広く行なわれてきた。いっぽう、「すざく」を用いた追求観測により、塵に深く埋もれた新しいタイプの AGN が発見された (本年会、江口らによるポスター講演参照)。これらの天体は、トーラスの開口角が非常に小さいため、狭輝線領域を照らす光が洩れにくく、中心核光度に比べてはるかに弱い [O III] 光度を示すことが予想されている。

我々のチームは、南アフリカ天文台 1.9m 望遠鏡を用いて、Swift/BAT AGN の完全サンプルの可視分光観測を系統的に進めている。本講演では、2008 年 1 月と 8 月に取得したデータから得られた初期成果を、特に [O III] 輝線光度と硬 X 線光度との相関に注目して報告する。